

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

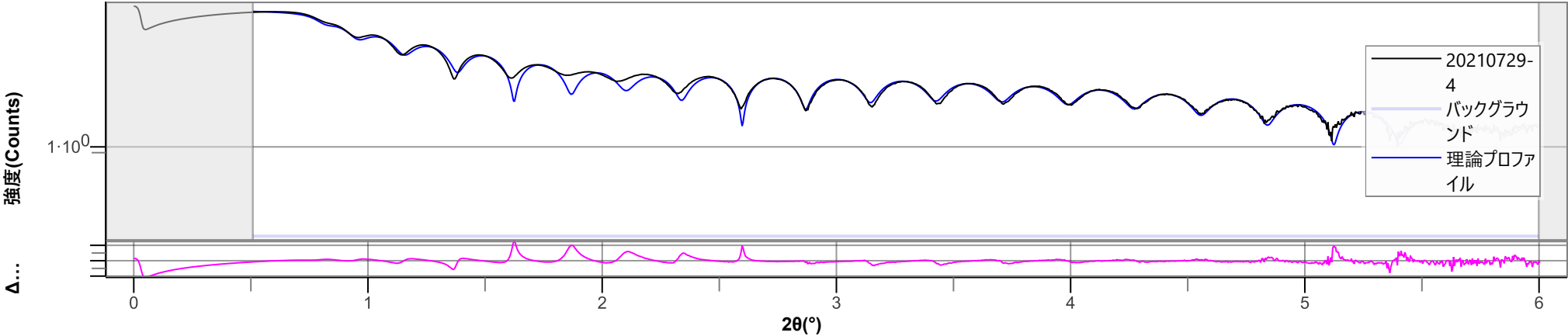
波長(nm): 0.1540593
点数: 1501
2θ(°):開始 = 0.000, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 9.27e-003

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	0.585 Const ±0.007 精密化	2.54589 Const ±0.05 最小ー 精密化	0.100 Con... ±0.02 最小ー 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe2O3	1.938 Const ±0.009 精密化	4.60535 Const ±0.02 ー最大 精密化	0.191 Con... ±0.014 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	29.320 Const ±0.01 精密化	7.75543 Const ±0.05 ー最大 精密化	0.283 Con... ±0.008 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	0.000 Const ±0.2 最小ー 精密化	3.93701 Const ±0.08 最小ー 精密化	0.342 Con... ±0.007 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	